IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of) Attorney Docket No.: ASAIN0137) Confirmation No.: 8630
Masayoshi TONOUCHI et al	,
Serial No.: 10/760-549) Group Art Unit: 2858
OFMARIA) Examiner: Unassigned
Filed: January 21, 2004)
For: METHOD AND APPARATUS FOR) Date: July 28, 2004
INSPECTING WIRE BREAKING OF)
INTEGRATED CIRCUIT)

SUBMISSION OF CLAIM FOR PRIORITY AND PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

It is respectfully requested that this application be given the benefit of the foreign filing date under the provisions of 35 U.S.C. §119 of the following, a certified copy of which is submitted herewith:

Application No.	Country of Origin	Filing Date
2003-012550	Japan	January 21, 2003
	Respectfully submitte	ed.

•

GRIFFIN & SZIPL, P.C.

Joerg-Uwe Szipl

Registration No. 31,799

GRIFFIN & SZIPL, P.C. Suite PH-1 2300 Ninth Street, South Arlington, VA 22204

Telephone: (703) 979-5700 Facsimile: (703) 979-7429 Email: g&s@szipl.com Customer No.: 24203

JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日一 Date of Application:

2003年 1月21日

特願2003-012550

Application Number:

人

[JP2003-012550]

出 願 Applicant(s):

[ST. 10/C]:

出

独立行政法人理化学研究所 アイシン精機株式会社

株式会社栃木ニコン

株式会社ニコン



PRIORITY DOCUMENT



2004年 3月24日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 1月21日

出願番号

特願2003-012550

Application Number: [ST. 10/C]:

[JP2003-012550]

出 願 人 Applicant(s):

独立行政法人理化学研究所 アイシン精機株式会社

株式会社栃木ニコン

株式会社ニコン



CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

2004年 3月24日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】

特許願

【整理番号】

P6736

【提出日】

平成15年 1月21日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H01L 21/66

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府箕面市小野原東4丁目9番23号

【氏名】

斗内 政吉

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】

川瀬 晃道

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地 アイシン精機株式会

社内

【氏名】

廣住 知也

【発明者】

【住所又は居所】

栃木県大田原市実取770 栃木ニコン株式会社内

【氏名】

深澤 亮一

【特許出願人】

【識別番号】

000006792

【氏名又は名称】

理化学研究所

【特許出願人】

【識別番号】

000000011

【氏名又は名称】

アイシン精機株式会社

【特許出願人】

【識別番号】

592171153

【氏名又は名称】

栃木ニコン株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 000004112

【氏名又は名称】 株式会社ニコン

【代理人】

【識別番号】 100097515

【住所又は居所】 東京都港区芝5丁目26番20号 建築会館4階 アサ

国際特許事務所

【弁理士】

【氏名又は名称】 堀田 実

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 027018

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9600194

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 集積回路断線検査方法と装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体集積回路(1)を所定の電圧印加状態に保持し、半導体集積回路の2次元回路上に、超短光パルス(2)を2次元的に走査して照射し、該照射位置から放射される電磁波(3)を検出し、該電磁波の有無又は強さから照射位置の断線を非接触で検出する、ことを特徴とする集積回路断線検査方法。

【請求項2】 前記超短光パルス(2)は、波長域が300ナノメートル以上、2ミクロン以下であり、時間平均のエネルギーが0.1mW以上、10W以下であり、パルス幅が1フェムト秒以上、10ピコ秒以下である、ことを特徴とする請求項1に記載の集積回路断線検査方法。

【請求項3】 半導体集積回路(1)を所定の電圧印加状態に保持する電圧 印加装置(12)と、超短光パルス(2)を発生する光パルス光源(14)と、 半導体集積回路の2次元回路上に超短光パルス(2)を2次元的に走査して照射 する走査装置(16)と、該照射位置から放射される電磁波(3)を検出する電 磁波検出装置(18)と、該電磁波の有無又は強さから照射位置の断線を検出す る断線検出装置(20)とを備えた、ことを特徴とする集積回路断線検査装置。

【請求項4】 前記光パルス光源(14)は、波長域が300ナノメートル以上、2ミクロン以下であり、時間平均のエネルギーが0.1mW以上、10W以下であり、パルス幅が1フェムト秒以上、10ピコ秒以下である超短光パルス(2)を発生可能なモード同期チタンサファイアレーザー、又はフェムト秒ファイバーレーザーである、ことを特徴とする請求項3に記載の集積回路断線検査装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、集積回路断線検査方法と装置に係り、更に詳しくは、光励起と放射 電磁波検出を併用した2次元配線像の非接触空間検査方法と装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

半導体集積回路の断線検査装置として、従来からエックス線検査装置、実体顕 微鏡による観察装置等が知られている。しかしいずれも、撮像により視覚的に断 線部を特定する技術であり、はんだ接合部等、撮像が困難な部位の微小なひび割 れ(クラック)などによる断線を検出することは困難であった。また、エックス 線検査装置は長時間の使用により健康を損なうおそれがある。

[0003]

一方、電圧を直接計測するテスターを用い、電圧印加状態で断線を検査する最も一般的な手段は、集積回路の配線が細かすぎて実際上不可能であり、電圧検出のために結線が必要であり、非接触では検出できない問題がある。

[0004]

上述した周知の検査装置の他に、集積回路の断線検査に用いられる従来技術として、配線の電位を検出する電子ビームテスターが知られている(例えば、[非特許文献1]、[非特許文献2])。

[0005]

【非特許文献1】

K. Nikawa, "Failure Analysis in Si Device Chips", IEICE Trans. Electron., Vol. E77-C, No. 4, pp. 528-534

【非特許文献2】

TODOKORO H, FUKUHARA S, KONODA T, "ELE CTRON-BEAM LSI TESTER", JAPAN ANNUAL R EVIEWS IN ELECTRONICS COMPUTERS & TE LECOMMUNICATIONS, vol. 13, pp. 373-382 (1984).

[0006]

また、半導体集積回路の断線故障検出装置として、 [特許文献1]、 [特許文献2]が既に出願されている。

[0007]

【特許文献1】

特開2000-311929号公報

【特許文献2】

特開2000-36525号公報

[0008]

[特許文献1]の「半導体集積回路の断線故障検出装置及びその断線故障検出 方法」は、IC製造プロセス中で、一工程終了後のウェハに対し配線層を形成す る側から電子ビームを入射し、または製造プロセス中でのプラズマとウェハ表面 の相互作用による配線を形成する側の帯電を利用することによって、拡散層に電 界を生ぜしめ、その電界変化を基板裏側からレーザー光を入射して、反射光の位 相や強度変化を電界光電効果検出装置によって検出して断線故障の生じている配 線を特定するものである。

[0009]

[特許文献2]の「半導体集積回路の断線故障検出装置、方法及び記憶媒体」は、検査対象となるLSIの電源線にパルス状の電源線電圧を、接地線に電源線電圧と位相が180度ずれたパルス状の接地線電圧を、信号線に定電圧の信号線電圧をそれぞれ印加する。このLSIに電子ビームを照射し、電源線電圧の立ち上がり直後の期間T1と、立ち下がり直後の期間T2でそれぞれLSIから放出される二次電子の量を検出する。これらの検出結果に基づいて、それぞれ故障状態の電位像(断線故障がある場合には、断線箇所の前後で明度が異なる画像)と、正常状態の電位像(断線故障があっても、断線箇所の前後で明度に差がでない画像)とを生成する。そして、故障状態の電位像と正常状態の電位像とを交互にディスプレイに表示するものである。

[0010]

また、本発明に関連する技術として、[非特許文献3]が知られている。

[0011]

【非特許文献3】

D. H. Auston and M. C. Nuss, "ELECTROOP

TIC GENERATION AND DETECTION OF FEMT OSECOND ELECTRICAL TRANSIENTS", IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS, volum e 24, pp. 184-197 (FEB 1988), Publisher: IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, NEW YORK, IDS Number: M6712, ISSN:0018-9197

$[0\ 0\ 1\ 2]$

【発明が解決しようとする課題】

上述した [非特許文献 1] 、 [非特許文献 2] の電子ビームテスター、および、 [特許文献 1] 、 [特許文献 2] の半導体集積回路の断線故障検出装置では、電子ビーム発生源を要し、かつ集積回路を真空チャンバー内にセットして電子ビーム照射を行う必要があるため、装置が高価かつ大型になる問題点があった。

[0013]

本発明はかかる問題点を解決するために創案されたものである。すなわち、本発明の目的は、半導体集積回路の微小なひび割れ(クラック)などによる断線を検出することができ、エックス線等により健康を損なうおそれがなく、非接触で検出でき、電子ビーム発生源や真空チャンバー等の高価かつ大型機器を必要とせず、大気中で短時間に容易に検出でき、かつ小型化かつ安価に製造できる集積回路断線検査方法と装置を提供することにある。

[0014]

【課題を解決するための手段】

本発明によれば、半導体集積回路(1)を所定の電圧印加状態に保持し、半導体集積回路の2次元回路上に、超短光パルス(2)を2次元的に走査して照射し、該照射位置から放射される電磁波(3)を検出し、該電磁波の有無又は強さから照射位置の断線を非接触で検出する、ことを特徴とする集積回路断線検査方法が提供される。

[0015]

また本発明によれば、半導体集積回路(1)を所定の電圧印加状態に保持する

電圧印加装置(12)と、超短光パルス(2)を発生する光パルス光源(14)と、半導体集積回路の2次元回路上に超短光パルス(2)を2次元的に走査して照射する走査装置(16)と、該照射位置から放射される電磁波(3)を検出する電磁波検出装置(18)と、該電磁波の有無又は強さから照射位置の断線を検出する断線検出装置(20)とを備えた、ことを特徴とする集積回路断線検査装置が提供される。

[0016]

上記本発明の方法及び装置によれば、電圧印加された半導体集積回路(1)に超短光パルス(2)を照射することにより、集積回路の各部位における電圧印加 状態により強弱の異なる電磁波(3)が放射される。従って、所定の電圧を印加 した半導体集積回路(1)に外部から超短光パルス(2)を照射することにより 発生した電磁波(3)を、外部の電磁波検出装置(18)を用いて検出すること により、最小空間分解能を光の波長とした、断面部位の2次元非接触自由空間検 出が可能となる。

$[0\ 0\ 1\ 7]$

また、電磁波(3)を検出する際に、走査装置(16)により半導体集積回路(1)或いは超短光パルス(2)を2次元的に走査することにより、発生した電磁波(3)による回路配線の2次元像が得られる。配線に断線があれば、断線箇所およびその先の配線からの電磁波強度が変化するため、断線部位を2次元的に検出することができる。

$[0\ 0\ 1\ 8]$

本発明の好ましい実施形態によれば、前記超短光パルス(2)は、波長域が300ナノメートル以上、2ミクロン以下であり、時間平均のエネルギーが0.1mW以上、10W以下であり、パルス幅が1フェムト秒以上、10ピコ秒以下である。

[0019]

超短光パルス(2)の波長域が300ナノメートル未満、時間平均のエネルギーが0.1mW未満、又はパルス幅が1フェムト秒未満である場合には、発生する電磁波(3)の強度が低く、検出が困難となる。また、超短光パルス(2)の

波長域が2ミクロンを超え、時間平均のエネルギーが10W以下を超え、或いはパルス幅が10ピコ秒を超える場合には、レーザー強度が強すぎ、半導体集積回路(1)に損傷を与えるおそれがある。

. [0020]

また、前記光パルス光源(14)は、波長域が300ナノメートル以上、2ミクロン以下であり、時間平均のエネルギーが0.1mW以上、10W以下であり、パルス幅が1フェムト秒以上、10ピコ秒以下である超短光パルス(2)を発生可能なモード同期チタンサファイアレーザー、又はフェムト秒ファイバーレーザーである。

[0021]

モード同期チタンサファイアレーザー、又はフェムト秒ファイバーレーザーを 用いることにより、上述した超短光パルス(2)を発生させることができる。

[0022]

【発明の実施の形態】

以下に本発明の好ましい実施形態を図面を参照して説明する。なお、各図において、共通する部分には同一の符号を付し重複した説明を省略する。

[0023]

図1は、[非特許文献 3]に開示された半導体光スイッチ構造を示す本発明の原理図である。この半導体光スイッチ構造は、超短光パルスを半導体スイッチに照射し、テラヘルツ域(周波数 10^{12} H z)に達する電磁波を空中に放射させるものであり、1988 年に米国のオーストン(D. H. Auston)らにより開発されている。

[0024]

図1において、半絶縁性GaAs基板上に光伝導膜として働く低温成長(LT-)GaAs薄膜を成長させ、さらにその上に5μm程度の間隙を設けたアンテナ構造を金合金で作成する。光パルスが照射された瞬間のみ電流が流れる光導電性薄膜として、Lt-GaAsが一般的に用いられている。金合金部分は電極も兼ねており、直流電圧源に接続されている。中央の出っ張り部分は微小ダイポールアンテナとして作用し、この間隙部分にレーザーのパルス光を当て励起すると

、光吸収によりキャリアは価電子帯から伝導帯へ励起され、励起された光キャリアは印加電圧により加速された後、緩和していく。このキャリアの動きを瞬時電流と考えるとこの電流の時間微分に比例したパルス電磁波が発生する。

[0025]

上述した半導体光スイッチ構造において、発生した電磁波の時間波形をフーリエ変換すると電磁波の周波数成分となる。従って超短光パルスを用いることによって、発生する電磁波の周波数成分がテラヘルツ帯域に達する高い周波数成分を有するようになる。

[0026]

図2は、本発明の集積回路断線検査装置の概略図である。この図に示すように、本発明の集積回路断線検査装置10は、電圧印加装置12、光パルス光源14、走査装置16、電磁波検出装置18および断線検出装置20を備える。

電圧印加装置12は、電源回路であり、検査対象である半導体集積回路1を所定の電圧印加状態に印加し保持する。所定の電圧印加状態とは、半導体集積回路1に適合する電圧(例えばDC10V)を電源ラインに印加し、アースラインを接地した状態をいう。従って、この状態において、電源ラインに接続された半導体集積回路1の回路部分は所定の電圧となり、アースラインに接続された回路部分はアース電圧(例えば0V)となり、その間に電位差が発生する。

[0027]

光パルス光源14は、超短光パルス2を発生する。光パルス光源14は、超短 光パルス2を発生可能なモード同期チタンサファイアレーザー、又はフェムト秒 ファイバーレーザーであるのがよい。

すなわち、電磁波の励起に際しては、光源として幅の小さなパルスを用いることにより、集積回路に大きな影響を及ぼさない状態で、電磁波の励起ができる。 熱的影響を及ぼさない最大光パルス幅は、約10ピコ秒と見積ることができる。

8/

[0028]

超短光パルス2の波長域が300ナノメートル未満、時間平均のエネルギーが0.1mW未満、又はパルス幅が1フェムト秒未満である場合には、発生する電磁波3の強度が低く、検出が困難となる。また、超短光パルス2の波長域が2ミクロンを超え、時間平均のエネルギーが10W以下を超え、或いはパルス幅が10ピコ秒を超える場合には、レーザー強度が強すぎ、半導体集積回路1に損傷を与えるおそれがある。

[0029]

走査装置16は、半導体集積回路1の2次元回路上に超短光パルス2を2次元的に走査して照射する。この例では、走査装置16は、光集光レンズ15、揺動ミラー16a、およびこれを揺動させる揺動装置16bからなり、揺動ミラー16aの揺動により、超短光パルス2を半導体集積回路1の2次元回路上に2次元的に走査して照射するようになっている。なお、本発明はこの構成に限定されず、半導体集積回路1を2次元的に移動してその上に超短光パルス2を走査してもよい。

[0030]

電磁波検出装置18は、例えば電磁波検出ボローメーター又は半導体光スイッチであり、超短光パルス2の照射位置から放射される電磁波3を検出する。

[0031]

断線検出装置20は、電磁波3の有無又は強さから照射位置の断線を検出する。断線検出装置20は、この例では、PC(コンピュータ)であり、光パルス光源14と走査装置16を制御し、電磁波検出装置18から入力される電磁波3の強度をCRT上の半導体集積回路1に対応する位置に明るさ又は色により表示し、電磁波3の強度から回路配線の2次元像をCRT上に表示するようになっている。この画像を正常な半導体集積回路1から得られる同様の画像と比較することにより、配線に断線があれば、断線箇所およびその先の配線からの電磁波強度が変化するため、断線部位を2次元的に検出することができる。

[0032]

上述した集積回路断線検査装置10を用い、本発明の集積回路断線検査方法に

よれば、半導体集積回路1を所定の電圧印加状態に保持し、半導体集積回路1の2次元回路上に、超短光パルス2を2次元的に走査して照射し、その照射位置から放射される電磁波3を検出し、電磁波の有無又は強さから照射位置の断線を非接触で検出する。

[0033]

上述した本発明の方法及び装置によれば、電圧印加された半導体集積回路1に超短光パルス2を照射することにより、集積回路の各部位における電圧印加状態により強弱の異なる電磁波3が放射される。従って、所定の電圧を印加した半導体集積回路1に外部から超短光パルス2を照射することにより発生した電磁波3を、外部の電磁波検出装置18を用いて検出することにより、最小空間分解能を光の波長とした、断面部位の2次元非接触自由空間検出が可能となる。

[0034]

また、電磁波3を検出する際に、走査装置16により半導体集積回路1或いは 超短光パルス2を2次元的に走査することにより、発生した電磁波3による回路 配線の2次元像が得られる。配線に断線があれば、断線箇所およびその先の配線 からの電磁波強度が変化するため、断線部位を2次元的に検出することができる

[0035]

従って、光パルスと電磁波検出を併用した集積回路断線検査装置を構成することにより、現在までにない集積回路断線の2次元検出装置が実現できる。

[0036]

【実施例】

図3は、本発明の実施例を示す電磁波の特性図である。この図において、(a) は半導体光スイッチにパルス幅50フェムト秒の超短光パルスを照射した結果発生した電磁波の時間波形であり、(b) はその電磁波の時間波形をフーリエ変換して得られる周波数成分である。

図3(b)の横軸は周波数、縦軸は強度であり、この図から発生する電磁波の 周波数成分は $0\,\mathrm{T}\,\mathrm{H}\,\mathrm{z}$ ($1\,\mathrm{T}\,\mathrm{H}\,\mathrm{z}=1\,0^{12}\,\mathrm{H}\,\mathrm{z}$)から $4\,\mathrm{T}\,\mathrm{H}\,\mathrm{z}$ 以上を含んでいる ことがわかる。従って波長は、可視光から紫外光におよび、最小空間分解能を光 の波長とした、断面部位の2次元非接触自由空間検出が可能となることがわかる

[0037]

次に、本発明に係る集積回路断線検査装置の実施例を詳細に説明する。

上述した図2は、本発明の実施例を示す集積回路断線検査装置の構成例である。すなわち、電圧印加状態にある集積回路1に光パルス2を照射することにより、電磁波3を発生させ、放射される電磁波3を電磁波検出装置18で観測するものである。

[0038]

照射用光源14にはアルゴンイオンレーザー励起のモード同期チタンサファイアレーザーにより発生されるパルス幅約50フェムト秒のレーザー光等を用いた。また、電磁波検出装置18として、インジウムアンチモン製ホットエレクトロンボロメーターを用いた。なお、電磁波検出装置18として、低温成長ガリウム砒素製光スイッチ等を用いることができる。

[0039]

図4は、本発明の実施例を示すCRT上の中間調画像である。この図は、被測 定物として用いた集積回路(半導体素子)を用いたものであり、図4(A)は半 導体素子の全体構造、図4(B)は素子中心部のガラス窓付近を拡大したものである。

この実施例において、10 Vのバイアス電圧を印加して中央のガラス窓の部分からビーム径30 μmに集光した光パルスを照射し走査することにより、放射電 磁波強度分布を2次元的に検出した。検出した集積回路からの放射電磁波強度を750 μm四方で走査した2次元分布を図4(C)に示す。

図4 (C) において、白い部分は電磁波放射強度が強いこと、すなわち電位差が大きいことを示している。

このように配線間で電位差が生じている場合、その部分からの電磁波放射強度 が変化することが示されている。このことは、断線箇所およびその先の配線から の電磁波放射強度が電位差変化に伴って変化することを意味し、本発明により断 線部位が検出できることが示された。

[0040]

なお、本発明は上述した実施形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変更できることは勿論である。

$[0\ 0\ 4\ 1]$

【発明の効果】

上述したように、本発明の集積回路断線検査方法と装置は、集積回路断線部位の検出が非接触に、かつ、自由空間から検出できる集積回路断線2次元検出装置が実現でき、これにより、半導体集積回路の微小なひび割れ(クラック)などによる断線を検出することができ、エックス線等により健康を損なうおそれがなく、非接触で検出でき、電子ビーム発生源や真空チャンバー等の高価かつ大型機器を必要とせず、大気中で短時間に容易に検出でき、かつ小型化かつ安価に製造できる。

【図面の簡単な説明】

図1

本発明の原理図である。

【図2】

本発明の半導体集積回路の断線検査装置の概略図である。

【図3】

本発明の実施例を示す電磁波の特性図である。

【図4】

本発明の実施例を示すCRT上の中間調画像である。

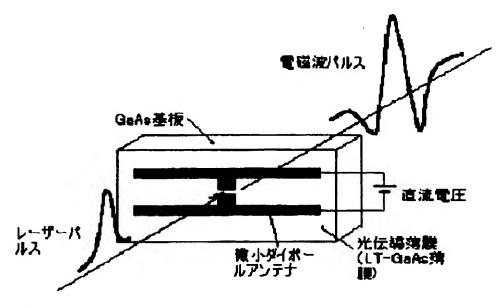
【符号の説明】

- 1 半導体集積回路、2 超短光パルス、3 電磁波、
- 10 集積回路断線検査装置、12 電圧印加装置、
- 14 光パルス光源、15 光集光レンズ、
- 16 走査装置、16 a 揺動ミラー、16 b 揺動装置、
- 18 電磁波検出装置、20 断線検出装置

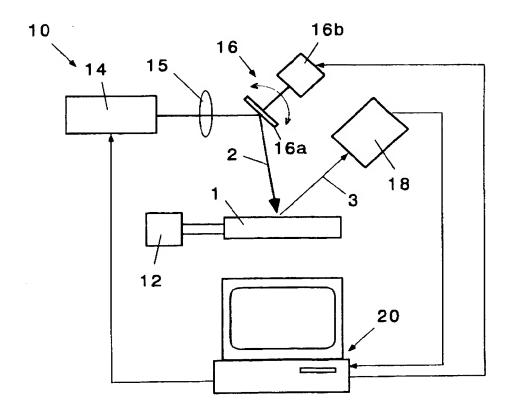
【書類名】

図面

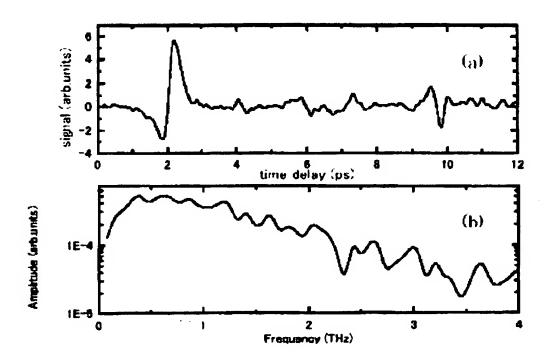
【図1】



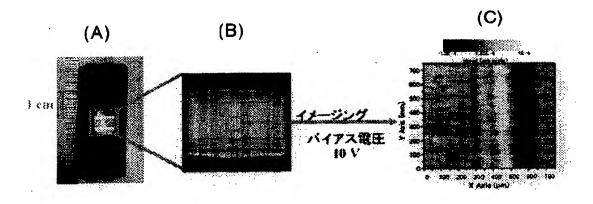
【図2】



【図3】



【図4】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 半導体集積回路の微小なひび割れ(クラック)などによる断線を検出することができ、エックス線等により健康を損なうおそれがなく、非接触で検出でき、電子ビーム発生源や真空チャンバー等の高価かつ大型機器を必要とせず、大気中で短時間に容易に検出でき、かつ小型化かつ安価に製造できる集積回路断線検査方法と装置を提供する。

【解決手段】 半導体集積回路1を所定の電圧印加状態に保持する電圧印加装置12と、超短光パルス2を発生する光パルス光源14と、半導体集積回路の2次元回路上に超短光パルス2を2次元的に走査して照射する走査装置16と、照射位置から放射される電磁波3を検出する電磁波検出装置18と、電磁波の有無又は強さから照射位置の断線を検出する断線検出装置20とを備える。

【選択図】 図2

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-012550

受付番号 50300090366

担当官 鈴木 夏生 6890

作成日 平成15年 1月22日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 000006792

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号

【氏名又は名称】 理化学研究所

【特許出願人】

【識別番号】 00000011

【住所又は居所】 愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地

【氏名又は名称】 アイシン精機株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 592171153

【住所又は居所】 栃木県大田原市実取770番地

【氏名又は名称】 株式会社栃木ニコン

【特許出願人】

【識別番号】 000004112

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

【氏名又は名称】 株式会社ニコン

【代理人】 申請人

【識別番号】 100097515

【住所又は居所】 東京都港区芝5丁目26番20号 建築会館4階

アサ国際特許事務所

【氏名又は名称】 堀田 実

【書類名】

出願人名義変更届 (一般承継)

【提出日】

平成15年12月 1日

【あて先】

特許庁長官殿

【事件の表示】

【出願番号】

特願2003-12550

【承継人】

【識別番号】

503359821

【住所又は居所】 【氏名又は名称】 埼玉県和光市広沢2番1号 独立行政法人理化学研究所

【承継人代理人】

【識別番号】

100075812

【弁理士】

【氏名又は名称】

吉武 賢次

【提出物件の目録】

【物件名】

権利の承継を証明する書面 1

【援用の表示】

平成15年11月20日提出の特許第1575167号外98件

にかかる一般承継による特許権の移転登録申請書

【物件名】

登記簿謄本 1

【援用の表示】

平成15年11月20日提出の特許第1575167号外98件

にかかる一般承継による特許権の移転登録申請書

【物件名】

委任状 1

【物件名】

委任状



委 任 状



私は、

識別番号 100075812 弁理士 吉 武 賢 次 氏 を代理人と定めて下記事項を委任する。

95454

- 1 別紙日録に記載の特許出願に関する出願人名義変更届をする件
- 2. 上記各項の手続を処理するため復代理人を選任及び解任する件

以上

平成 / 5 年 // 月 / 9 日

住所又は居所 埼玉県和光市広沢2番1号 氏名又は名称 独立行政法人 理化学研究所 代表者 理事長 野 依 良 治

目録(1)

```
特顧昭63-235737
                              特願平07-327372
1.
                          51.
2.
   特願平05-044143
                          52.
                              特願平08-000652
3.
   特願平05-127257
                          53.
                              特願平08-026368
4.
   特顧平05-127258
                          54.
                              特願平08-030850
   特願平05-213675
5.
                          55.
                              特願平08-041279
6.
   特願平05-306164
                          56.
                              特顧平08-045903
7.
   特願平05-328611
                          57.
                              特願平08-051604
8.
   特願平05-336746
                          58.
                              特願平08-065715
9.
   特願平06-035100
                          59.
                              特願平08-070071
10.
   特願平06-061792
                          60.
                              特顧平08-105667
                          61.
11.
   特願平06-061793
                              特願平08-107784
12.
   特願平06-069150
                          62.
                              特願平08-116473
   特願平06-097098
                              特願平08-123475
13.
                          63.
14.
   特願平06-111624
                          64.
                              特願平08-127005
15.
   特顧平06-121100
                          65.
                              特願平08-131746
16.
   特願平06-145908
                          66.
                              特願平08-132846
17.
   特願平06-158670
                          67.
                              特願平08-132854
18.
   特願平06-158671
                          68.
                              特願平08-142676
19.
   特願平06-165751
                          69.
                              特願平08-158078
20.
   特願平06-165752
                          70.
                              特願平08-167401
21.
   特願平06-181857
                          71.
                              特願平08-196331
   特願平06-235742
22.
                          72.
                             特願平08-197050
23.
   特願平06-238603
                          73.
                             特願平08-197051
   特願平06-244764
                          74.
                             特願平08-211946
24.
25.
   特願平06-248486
                          75.
                             特願平08-216506
26.
   特願平06-252942
                          76.
                             特顧平08-216508
27.
                          77.
   特願平06-268723
                             特願平08-222352
28.
   特顯平06-293933
                          78.
                             特願平08-231066
29.
                          79.
   特願平06-301372
                             特願平08-233442
30.
   特願平06-323795
                          80.
                             特願平08-236685
31.
   特願平06-324490
                          81.
                             特願平08-251410
32.
   特願平06-507966(不服2002-12420)82.
                             特願平08-262051
33.
   特願平07-007185
                          83.
                             特願平08-302896
34.
   特願平07-069255
                          84.
                             特願平08-308335
35.
   特願平07-082880
                          85.
                             特願平08-308336
36.
   特願平07-083142
                          86.
                             特願平08-311467
37.
   特願平07-117933
                          87.
                             特願平08-315093
38.
   特願平07-133487
                          88.
                             特願平08-317622
39.
   特願平07-205141
                          89.
                             特願平08-320241
40.
   特願平07-214659
                          90.
                             特願平08-506395
                             特願平09-002295
41.
   特願平07-217276
                          91.
42.
   特願平07-236185
                          92.
                             特願平0.9-010602
   特願平07-240684
43.
                          93.
                             特願平09-019968
                          94.
44.
   特願平07-249244
                             特願平0:9-019969
45.
   特願平07-259922
                          95.
                             特願平09-019971
   特願平07-282716
46.
                          96.
                             特願平09-024890
                          97.
47.
   特願平07-302793
                             特願平09-028982
48.
   特願平07~306004
                          98.
                             特願平09-046824
49.
   特顧平07-311711
                          99.
                             特願平09-049254
   特願平07-311715
                          100.
                             特願平09-053478
```

目錄(2)

101.	特願平09-054595	151. 特願平10-045434
102.	特願平09-056654	152. 特願平10-049499
103.	特願平09-057342	153. 特願平10-049867
104.	特願平09-058774	154. 特願平10-051489
105.	特願平09-067611	155. 特願平10-051490
106.	特願平09-074394	156. 特願平10-051491
107.	特願平09-080480	157. 特願平10-051492
108.	特願平09-082965	158. 特願平10-051493
109.	特願平09-091523	159. 特願平10-060740
110.	特願平09-091591	160. 特願平10-060741
111.	特願平09-091694	161. 特願平10-061895
112.	特願平09-096968	162. 特願平10-076139
113.	特願平09-099061	163. 特願平10-085207
114.	特願平09-099109	164. 特願平10-085207
115.	特願平09-104093	165. 特顧平10-103083
116.	特願平09-119730	166. 特願平10-103115
117.	特願平09-129068	167. 特願平10-103115
118.	特願平09-134525	168. 特願平10-103071
119.	特願平09-134525	
120.	特願平09-155364	170. 特願平10-116378
121.	特願平09-159963 特願平09-163630	171. 特願平10-121456
122.		172. 特願平10-127520
123.	特願平09-163631	173. 特願平10-136198
124.	特願平09-171924	174. 特願平10-149603
125.	特願平09-175896	175. 特願平10-150494
126.	特願平09-180423	176. 特願平10-151245
127.	特願平09-189436	177. 特願平10-155838
128.	特顧平09-198201 特顧平09-208866	178. 特顯平10-155841
129.		179. 特願平10-156104
130.	特願平09-221067 特願平09-228345	180. 特願平10-156108
131.		181. 特願平10-198313
132.	特願平09-230870 特願平09-253740	182. 特願平10-200280
133.		183. 特願平10-217132
134. 135.	特願平09-256795 特願平09-271782	184. 特願平10-217180 185. 特願平10-222837
136.	特願平09-291995	185. 特願平10-222837 186. 特願平10-227939
	特願平09-291995	
137.		187. 特願平10-229591
138.	特願平09-307627	188. 特顯平10-232520
139.	特願平09-308597 特願平09-309848	189. 特願平10-232590
140.		190. 特願平10-236009
141.		191. 特顯平10-237485
142.	特願平09-327609	192. 特額平10-238144
143.	特願平09-328742	193. 特顧平10-245293
144.	特願平09-360327	194. 特願平10-250598
145.	特顯平10-002030	195. 特願平10-250611
146.	特願平10-010471	196. 特願平10-252128
147.	特願平10-014152	197. 特願平10-260347
148.	特願平10-015690	198. 特願平10-260416
149.	特願平10-024892	199. 特願平10-268791
150.	特願平10-043335	200. 特願平10-269859

目録(3)

201.	特願平10-272529	251. 特願平11-135137	
202.	特願平10-280351		
203.	特願平10-200331		
204.	特願平10-308333		
204.	特願平10-309705	254. 特願平11-144005 255. 特願平11-147097	
205.			
	特願平10-311674	256. 特願平11-151099	
207.	特願平10-311675	257. 特願平11-166247	
208.	特願平10-314856	258. 特願平11-173839	
209.	特願平10-315751	259. 特願平11-179278	
210.	特願平10-338896	260. 特顯平11-186052	
211.	特願平10-338897	261. 特願平11-193235	
212.	特願平10-338898	262. 特願平11-224269	
213.	特願平10-338899	263. 特願平11-225060	
214.	特願平10-352428	264. 特願平11-225832	
215.	特願平10-354665	265. 特願平11-225839	
216. 217.	特願平10-363297	266. 特願平11-226176	
217.	特願平10-363329	267. 特願平11-234800	
	特願平10-506788	268. 特願平11-240325	
219. 220.	特願平10-532832 特願平10-535583	269. 特願平11-240910	
221.	特願平11-008183	270. 特願平11-241737 271. 特願平11-242438	
222.	特願平11-008183	272. 特顯平11-242438	
223.	特願平11-015380 特願平11-015176	273. 特願平11-253851	
224.	特願平11-013170 特願平11-031724	274. 特願平11-253651	
225.	特願平11-031724	275. 特願平11-277759	
226.	特顯平11-046372	276. 特願平11-278976	
227.	特顧平11-055835	277. 特願平11-279324	
228.	特願平11-055867	278. 特願平11-281632	
229.	特願平11-055930	279. 特願平11-303976	
230.	特願平11-056957	280. 特願平11-309616	
231.	特願平11-057381	281. 特願平11-315036	
232.	特願平11-057749	282. 特願平11-321282	
233.	特願平11-058103	283. 特顯平11-336079	
234.	特願平11-061079	284. 特願平11-346467	
235.	特願平11-061080	285. 特願平11-354563	
236.	特顧平11-064193	286. 特願平11-360274	
237.	特願平11-064372	287. 特顧平11-365899	
238.	特願平11-064506	288. 特顧平11-373483	
239.	特願平11-065136	289. 特顯平11-510791	
240.	特願平11-074385	290. 特顯平11-515324	
241.	特願平11-081225	291. 特願2000-00178	3
242.	特顯平11-090383	292. 特願2000-00522	1
243.	特願平11-091875	293. 特願2000-00936	3
244.	特顯平11-103231	294. 特願2000-01051	6
245.	特願平11-104509	295. 特願2000-01114	
246.	特顯平11-106920	296. 特顯2000-01162	3
247.	特願平11-124187	297. 特願2000-01651	
248.	特願平11-130771	298. 特願2000-01662	
249.	特願平11-130814	299. 特願2000-01711	
250.	特願平11-130815	300. 特願2000-01861	2

目錄(4)

301.	特願2000-019195	351.	特顧2000-141763
302.	特願2000-019528	352.	特願2000-148843
303.	特願2000-020067	353.	特願2000-152455
304.	特願2000-030321	354.	特願2000-152469
305.	特願2000-034109	355.	特願2000-154484
306.	特願2000-039082	356.	特願2000-161895
307.	特願2000-040355	357.	特願2000-163122
308.	特願2000-041927	358.	特願2000-164584
309.	特願2000-041929	359.	特願2000-179723
310.	特願2000-045318	360.	特願2000-181281
311.	特顧2000-045855	361.	特願2000-184259
312.	特顧2000-051488	362.	待顧2000-184295
313.	特顧2000-051650	363.	特願2000-191007
314.	特願2000-052040	364.	特願2000-191265
315.	特願2000-053707	365.	特顧2000-192332
316.	特願2000-054949	366.	特願2000-193817
317.	特願2000-056093	367.	特願2000-195384
318.	特願2000-056879	368.	特願2000-196991
319.	特願2000-057564	369.	特願2000-197022
320.	特願2000-057565	370.	特願2000-202801
321.	特願2000-057566	371.	特願2000-216457
322.	特願2000-058133	372.	特願2000-223714
323.	特願2000-058282	373.	特顧2000-224970
324.	特願2000-062316	374.	特願2000-225486
325.	特願2000-064142	375.	特願2000-225864
326.	特願2000-064209	376.	特願2000-225978
327.	特願2000-071119	377.	特願2000-226361
328.	特願2000-076122	378.	特顧2000-229191
329.	特願2000-085874	379.	特願2000-230551
330.	特願2000-089078	380.	特願2000-237165
331.	特願2000-092693	381.	特願2000-237166
332.	特願2000-100395	382.	特願2000-237533
333.	特願2000-105139	383.	特願2000-246309
334.	特願2000-105917	384.	特顧2000-248331
335.	特願2000-107160	385.	特願2000-249232
336.	特願2000-108409	386.	特顧2000-256149
337.	特願2000-109638	387.	特顧2000-257080
338.	特願2000-109954	388.	特顧2000-257083
339.	特願2000-118361	389.	特顧2000-260030
340.	特願2000-120874	390.	特顯2000-261233
341.	特願2000-123634	391.	特願2000-264743
342.	特願2000-128431	392.	特顧2000-265344
343.	特願2000-131049	393.	特顧2000-278502
344.	特願2000-131050	394.	特願2000-279557
345.	特願2000-131745	395.	特願2000-292422
346.	特願2000-134427	396.	特願2000-292832
347.	特願2.000-136551	397.	特願2000-299812
348.	特願2000-136572	398.	特願2000-307464
349.	特願2000-138977	399.	特願2000-308248
350.	特願2000-141566	400.	特願2000-309581

目録(5)

401.	特願2000-319775	451. 特願2001-071435
402.	特願2000-322056	452. 特願2001-072650
403.	特願2000-333311	453. 特願2001-072668
404.	特顯2000-334686	454. 特願2001-072963
405.	特願2000-334969	455. 特願2001-073028
406.	特願2000-343912	456. 特願2001-074964
407.	特願2000-347398	457. 特願2001-074965
408.	特願2000-347865	458. 特願2001-077257
409.	特願2000-358121	459. 特顧2001-078671
410.	特願2000-368566	460. 特願2001-084173
411.	特顧2000-374626	461. 特願2001-089541
412.	特願2000-375090	462. 特願2001-091911
413.	特願2000-378421	463. 特願2001-092337
414.	特願2000-378942	464. 特願2001-116171
415.	特願2000-378950	465. 特願2001-124294
416.	特願2000-384771	466. 特願2001-124452
417.	特願2000-387016	467. 特顧2001-127575
418.	特願2000-394815	468. 特顧2001-127576
419.	特顧2000-396445	469. 特願2001-135357
420.	特願2000-399940	470. 特願2001-137087
421.	特願2000-400336	471. 特願2001-138103
422.	特願2000-401110	472. 特願2001-142583
423.	特願2000-401245	473. 特願2001-147081
424.	特願2000-401258	474. 特願2001-152364
425.	特願2000-503838	475. 特願2001-152379
426.	特願2000-571733	476. 特願2001-153447
427.	特願2000-571943	477. 特願2001-155572
428.	特願2000-602588	478. 特顧2001-163740
429.	特願2000-602900	479. 特額2001-164819
430.	特願2000-618709	480. 特顧2001-164997
431.	特顧2001-003476	481. 特願2001-165133
432. 433.	特顧2001-005615 特顧2001-007979	482. 特願2001-167910
433. 434.	特顧2001-007979	483. 特願2001-168784
434. 435.	特顧2001-016626 特顧2001-025030	484. 特顧2001-171705 485. 特顧2001-173331
436.	特顧2001-037141	
437.	特願2001-037141	486. 特顧2001-174421 487. 特顧2001-174553
438.	特願2001-042501	488. 特顧2001-174553
439.	特願2001-044933	489. 特顧2001-178169
440.	特願2001-047762	490. 特顧2001-178109
441.	特願2001-050645	491. 特顧 2 0 0 1 - 1 8 0 5 5 2
442.	特願2001-053550	492. 特願 2 0 0 1 - 1 8 0 5 5 4
443.	特願2001-054717	493. 特顧2001-187735
444.	特願2001-059115	494. 特顧2001-197185
445.	特願2001-059892	495. 特顧2001-197897
446.	特願2001-060848	496. 特顧2001-191851
447.	特願2001-062703	497. 特顧 2 0 0 1 - 2 0 1 3 5 6
448.	特願2001-065799	498. 特顧2001-201971
449.	特願2001-065917	499. 特願2001-203089
450.	特願2001-068285	500. 特願2001-206505
		000. 10mm 2 0 0 1 2 0 0 3 0 0

目録(6)

501.	特願2001-206522	551. 特願2001-325367
502.	特願2001-206523	552. 特願2001-326872
503.	特願2001-209305	553. 特願2001-327853
504.	特願2001-212947	554. 特願2001-329023
505.	特願2001-216505	555. 特願2001-332168
506.	特顧2001-220219	556. 特願2001-337467
507.	特願2001-226176	557. 特願2001-339396
508.	特願2001-228287	558. 特願2001-339593
509.	特願2001-228374	559. 特顧2001-346035
510.	特願2001-235412	560. 特願2001-347316
511.	特顧2001-235747	561. 特願2001-347637
512.	特願2001-238951	562. 特願2001-349614
513.	特願2001-241023	563. 特願2001-351730
514.	特願2001-243930	564. 特願2001-352189
515.	特願2001-246642	565. 特願2001-353038
516.	特願2001-249976	566. 特願2001-358446
517.	特願2001-254377	567. 特顧2001-358581
518.	特願2001-254378	588. 特願2001-359710
519.	特願2001-255589	569. 特願2001-374928
520.	特顧2001-256576	570. 特願2001-376591
521.	特願2001-257188	571. 特願2001-378757
522.	特顯2001-261158	572. 特願2001-380473
523.	特願2001-266004	573. 特願2001-382537
524.	特願2001-266069	574. 特願2001-382539
525.	特願2001-266454	575. 特願2001-382599
5 26.	特願2001-267194	576. 特顧2001-385258
527.	特願2001-267379	577. 特願2001-385512
528.	特願2001-267863	578. 特願2001-385513
529.	特願2001-272977	579. 特願2001-385538
5 30.	特願2001-273964	580. 特顧2001-388116
531.	特願2001-276053	581. 特願2001-390122
532.	特顧2001-279406	582. 特願2001-392087
5 33.	特願2001-280319	583. 特願2001-392088
534.	特願2001-285145	584. 特願2001-395196
535.	特願2001-291059	585. 特顧2001-396120
536.	特願2001-292223	586. 特願2001-397762
537.	特願2001-292224	587. 特顧2001-397998
538.	特願2001-293000	588. 特顧2001-401139
539.	特願2001-293054	589. 特顧2001-515803
540.	特願2001-293936	590. 特願 2 0 0 1 - 5 2 3 8 5 2
541.	特願2001-294013	591. 特顧2001-557672
542.	特願2001-298140	592. 特願2002-000993
543.	特願2001-298402	593. 特願2002-005746
544.	特願2001-307340	594. 特願2002-010344
545.	特願2001-309501	595. 特願2002-011558
546.	特願2001-309508	596. 特顧2002-019752
547.	特願2001-309984	597. 特願2002-020329
548.	特願2001-310554	598. 特願2002-022499
549.	特願2001-313430	599. 特顧2002-028046
550.	特願2001-319360	600. 特願2002-028109

目録(7)

601.	特願2002-040151	651. 特願2002-162157
602.	特願2002-042829	652. 特願2002-162211
603.	特願2002-044340	653. 特願2002-162365
604.	特願2002-044640	654. 特願2002-167759
605.	特願2002-046188	655. 特願2002-170068
606.	特願2002-047799	656. 特願2002-170902
607.	特願2002-053190	657. 特願2002-176435
608.	特願2002-053575	658. 特顧2002-176583
609.	特願2002-055272	659. 特願2002-183722
610.	特願2002-057253	660. 特願2002-185966
611.	特願2002-057565	661. 特願2002-187362
612.	特願2002-057935	662. 特願2002-187957
613.	特願2002-057963	663. 特願2002-188281
614.	特願2002-066249	664. 特願2002-189265
615.	特願2002-070624	665. 特願2002-194627
616.	特願2002-070987	666. 特願2002-197812
617.	特願2002-071924	667. 特願2002-201443
618.	特顧2002-074902	668. 特顯2002-201575
619.	特願2002-078164	669. 特願2002-202118
620.	特願2002-081467	670. 特願2002-205814
621.	特願2002-081502	671. 特願2002-205825
622.	特願2002-083081	672. 特願2002-217714
623.	特願2002-084139	673. 特願2002-221188
624.	特願2002-085017	674. 特顧2002-225469
625.	特願2002-087342	675. 特顧2002-225724
626.	特願2002-094681	676. 特顯2002-226859
627.	特願2002-095132	677. 特願2002-227286
628.	特願2002-095389	678. 特願2002-229686
629.	特願2002-100431	679. 特顧2002-230562
630.	特願2002-106561	680. 特願2002-235294
631.	特願 2 0 0 2 ~ 1 1 9 3 2 0	681. 特願2002-235737
632.	特願 2002-120371	682. 特顧2002-236838
633.	特願2002-123347	683. 特顧2002-237058
634.	特願 2 0 0 2 - 1 2 8 8 5 4	684. 特額2002-237092
635. 636.	特願2002-133717 特願2002-133749	685. 特願2002-248946
637.	特願 2 0 0 2 ~ 1 3 4 3 1 3	686. 特願2002-253322
638.	特願2002-134313	687. 特願2002-253689 688. 特願2002-253697
639.	特願2002-141187	
640.	特願2002-141436	689. 特願2002-254096 690. 特願2002-257924
641.	特願2002-142200	691. 特顧2002-260788
642.	特願2002-149931	692. 特願2002-260788
643.	特願2002-150541	693. 特顧2002-261499
644.	特願2002-154688	694. 特顧2002-267114
645.	特願2002-154695	695. 特願2002-267114
646.	特願2002-154823	696. 特顧2002-268987
647.	特願2002-154323	697. 特願2002-270917
648.	特願2002—13823;	698. 特顧2002-271375
649.	特願2002-130332	699. 特願2002-271473
650.	特願2002-160217	700. 特願2002-273996
000.	INDESCRIPTION OF THE PROPERTY	100. 10 mg 2 0 0 2 - 2 1 4 4 0 9

目録(8)

701.	特願2002-276051	751. 特願2003-012738
702.	特願2002-282746	752. 特願2003-012774
703.	特願2002-286487	753. 特願2003-015968
704.	特願2002-289209	754. 特願2003-016044
705.	特願2002-295332	755. 特願2003-016940
706.	特願2002-296911	756. 特願2003-017397
707.	特願2002-299429	757. 特顧2003-021499
708.	特願2002-301875	758. 特願 2 0 0 3 - 0 2 4 3 4 7
709.	特願2002-303838	759. 特願2003-024620
710.	特願2002-312131	760. 特願2003-025277
711.	特願2002-320102	761. 特願2003-027647
712.	特顧2002-320704	762. 特願2003-027648
713.	特願2002-325909	763. 特願2003-027648
714.	特願2002-325920	764. 特顧2003-031882
715.	特願2002-332232	765. 特顧2003-032932
716.	特願2002-339344	
717.	特願2002-339394	
718.	特願2002-339592	
719.	特願2002-339541	
720.	特願2002-339551	769. 特願2003-050446
721.	特願2002-341193	770. 特願2003-052520 771. 特願2003-052602
722.	特願2002-344279	
723.	特願2002-345279	***************************************
724.	特願 2 0 0 2 — 3 4 7 4 0 1	773. 特願2003-052877 774. 特願2003-053023
725.	特願2002-347401	
726.	特願2002-348700	
727.	特願2002-354594	776. 特願2003-054798 777. 特顯2003-054799
728.	特願2002-354394	
729.	特願2002-357708	
730.	特願2002-358019	
731.	特顧2002-358967	780. 特願2003-054848 781. 特願2003-054849
732.	特願2002-360972	782. 特願2003-055452
733.	特願2002-360975	783. 特願2003-056628
734.	特願2002-368112	784. 特願2003-050028
735.	特願2002-376555	785. 特願2003-061426
736.	特願2002-376774	786. 特願2003-065013
737.	特顧2002-376831	787. 特顧2003-071028
738.	特顧2002-379214	788. 特顧2003-072979
739.	特願2002-380624	789. 特顧2003-074168
740.	特願2002-381888	790. 特願2003-076107
741.	特願2002-382170	791. 特顧2003-078999
742.	特願2002-383870	792. 特顧2003-079598
743.	特願2002-521644	793. 特願2003-079613
744.	特願2002-532458	794. 特願2003-079613
745.	特願2002-546564	795. 特願2003-082466
746.	特願2002-548185	796. 特顧2003-083433
747.	特願2002-570743	
748.	特願2003-003450	797. 特願2003-083480 798. 特願2003-085193
749.	特願 2 0 0 3 - 0 1 2 5 5 0	
750.	特願2003-012550	799. 特願2003-089026
100.	TUMR 2 0 0 0 0 1 2 0 9 4	800. 特顧2003-090331

目録(9)

801.	特願2003-091446	851. 特顧2003-127135
802.	特願2003-092654	852. 特顧2003-127150
803.	特願2003-093642	853. 特顧2003-128818
804.	特願2003-094272	854. 特顧2003-128897
805.	特願2003-094719	855. 特願2003-129347
806.	特願2003-095770	856. 特願2003-131313
807.	特願2003-095884	857. 特願2003-132280
808.	特願2003-095885	858. 特願2003-132605
809.	特願2003-095886	859. 特願2003-132606
810.	特願2003-095904	860. 特願2003-135591
811.	特願2003-097283	861. 特願2003-136445
812.	特顧2003-097327	862. 特願2003-139397
813.	特願2003-101917	863. 特願2003-140684
814.	特願2003-104928	864. 特願2003-142303
815.	特願2003-105362	865. 特願2003-143932
816.	特願2003-107267	866. 特願2003-145221
817.	特願2003-107268	867. 特願2003-145390
818.	特願2003-107647	868. 特願2003-147820
819.	特願2003-107885	869. 特願2003-150690
820.	特願2003-109575	870. 特願2003-153014
821.	特願2003-115750	871. 特願2003-153015
822.	特願2003-115793	872. 特願2003-153016
823.	特顧2003-115847	873. 特願2003-153985
824.	特顧2003-115888	874. 特願2003-154009
825.	特願2003-116232	875. 特願2003-154841
826.	特願2003-116895	876. 特顧2003-155397
827.	特願2003-118161	877. 特願2003-155407
828.	特願2003-118186	878. 特顧2003-158017
829.	特願 2 0 0 3 - 1 1 9 7 4 9	879. 特顧2003-161005
830.	特願2003-119930	880. 特顧2003-164126
831.	特願2003-120934	881. 特願2003-170051
832.	特願2003-121233	882. 特願2003-170324
833.	特願2003-121261	883. 特願2003-170325
834.	特願2003-121273	884. 特願2003-170326
835.	特願2003-121780	885. 特願 2 0 0 3 - 1 7 0 3 2 7
836.	特顧 2 0 0 3 - 1 2 2 2 4 5	886. 特顯2003-170328
837. 838.	特願2003-123984 特願2003-124654	887. 特願 2003-170329
839.	特願 2 0 0 3 - 1 2 4 6 5 5	888. 特願2003-170330 889. 特顧2003-170573
840.	特願2003-124035	
841.	特顯2003-124829	
842.	特願2003—124823	891. 特願2003-171619 892. 特顧2003-172898
	特願 2 0 0 3 - 1 2 4 8 3 5	
843. 844.	特願2003-124035	893. 特顧 2 0 0 3 - 1 7 5 8 1 9 894. 特顧 2 0 0 3 - 1 7 7 2 9 8
845.	特願 2 0 0 3 - 1 2 5 3 6 6	895. 特願2003-177298
	•	
846.	特願2003-125405 特願2003-127000	
847. 848	特願2003-127090 特願2003-127092	897. 特顯2003-192763
848. 849.	特願2003-127093 特願2003-127100	898. 特願2003-192775
	特願2003-127109 特願2003-127130	899. 特願2003-194837
850.	特願2003-127130	900. 特願2003-197229

目録(10)

901.	特願2003-198340
902.	特願2003-204075
903.	特願2003-205349
904.	特願2003-205710
905.	特願2003-206546
906.	特願2003-207698
907.	特願2003-207771
908.	特願2003-207772
909.	特願2003-207850
910.	特願2003-270049
911.	特願2003-271473
912.	特願2003-272421
913.	特願2003-275055
914.	特願2003-277958
915.	特願2003-279130
916.	特願2003-283972
917.	特願2003-284055
918.	特顧2003-286640
919.	特願2003-289138
920.	特願2003-293912
921.	特願2003-296474
922.	特願2003-298558
923.	特願2003-299424
924.	特願2003-303979
925.	特願2003-304452
926.	特願2003-304453
927.	特願2003-305689
928.	特願2003-305844
929.	特願2003-306137
930.	特願2003-307564
931.	特願2003-313014
932.	特願2003-315355
933.	特願2003-318801
934.	特願2003-321497
935.	特願2003-322948
936.	特願2003-324974
937.	特願2003-326510
938.	特願2003-327645
939.	特願2003-327907
940.	特顧2003-328600
941.	特願2003-328840
942.	特願2003-330418
943.	特願2003-330569
944.	特願2003-331848
945.	特願2003-332756
946.	特顧2003-333798
947.	特願2003-333932
948.	特願2003-334036
949.	特願2003-334083
950.	特願2003-336365

 951.
 特願2003-338191

 952.
 特願2003-339542

 953.
 特願2003-340181

 954.
 特願2003-342519

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-012550

受付番号 20308550742

書類名 出願人名義変更届(一般承継)

担当官 鈴木 夏生 6890

作成日 平成16年 3月17日

<認定情報・付加情報>

【提出された物件の記事】

【提出物件名】 委任状(代理権を証明する書面) 1

出証特2004-3001917

出願人履歴情報

識別番号

[000006792]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所

埼玉県和光市広沢2番1号

氏 名

理化学研究所

出願人履歴情報

識別番号

[000000011]

1. 変更年月日

1990年 8月 8日

[変更理由]

新規登録

住 所

愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地

氏 名 アイシン精機株式会社

出願人履歴情報

識別番号

[592171153]

1. 変更年月日

1992年 7月16日

[変更理由]

新規登録

住 所

栃木県大田原市実取770番地

氏 名 株式会社栃木ニコン

出願人履歴情報

識別番号

[000004112]

1. 変更年月日

1990年 8月29日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

氏 名

株式会社ニコン



出願人履歴情報

識別番号

[503359821]

1. 変更年月日 [変更理由]

() 世田 」住 所氏 名

2003年10月 1日

新規登録

埼玉県和光市広沢2番1号 独立行政法人理化学研究所